

DIN CEN/TS 15605:2008-02 (D)

Kupfer und Kupferlegierungen - Optische Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppelter Plasmaanregung; Deutsche Fassung CEN/TS 15605:2007

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	6
3 Kurzbeschreibung	7
4 Reagenzien und Stoffe	7
5 Gerät	12
5.1 Übliche Laboratoriumsausstattung	12
6 Probenahme	12
7 Durchführung	12
7.1 Verfahren A: Kupfer	12
7.2 Verfahren B: Kupfer-Zink-Legierungen	16
7.3 Verfahren C: Kupfer-Zinn-Legierungen	20
7.4 Verfahren D: Kupfer-Aluminium-Legierungen	24
7.5 Verfahren E: Kupfer-Beryllium-Legierungen	28
7.6 Verfahren F: Kupfer-Nickel-Legierungen	32
7.7 Verfahren G: Kupfer-Blei-Zinn-Legierung	36
8 Angabe der Ergebnisse	40
9 Präzision	41
9.1 Verfahren B — Kupfer-Zink-Legierungen	41
9.2 Verfahren C — Kupfer-Zinn-Legierungen	42
9.3 Verfahren D — Kupfer-Aluminium Legierungen	43
9.4 Verfahren F — Kupfer-Nickel-Legierungen	44
9.5 Verfahren G — Kupfer-Blei-Zinn-Legierung	44
10 Prüfbericht	44
Anhang A (informativ) Optisches Emissionsspektrometer (OES) — Zur Überprüfung vorgeschlagene Leistungskriterien	45
Literaturhinweise	47